

Bildgebende Verfahren zur Fehleranalyse von elektronischen Bauteilen

Associate Professor Till Leissner,

The Faculty of Engineering, Mads Clausen Institute (MCI)

University of Southern Denmark, Sønderborg

Abstract

Am Mads Clausen Institut der Universität von Süddänemark in Sønderborg verwenden wir hochauflösende bildgebende and spektroskopische Methoden, um Materialien auf Mikro- und Nanoskalen zu analysieren. Dabei steht der Zusammenhang zwischen Funktion und Eigenschaften auf der einen Seite und chemischer Zusammensetzung und Struktur auf der anderen Seite im Vordergrund. Durch die Korrelation verschiedener sich ergänzender Verfahren lässt sich dabei ein breites Verständnis gewinnen.

In meiner Präsentation werde ich unter anderem am Beispiel der Fehleranalyse elektronischer Bauteile die vorhandenen Methoden wie ultrahochauflösende Mikroskopie und -lithographie mit fokussierten Ionenstrahlen, Röntgentomographie und konfokaler Raman-Spektroskopie vorstellen.